

(12) International Application Status Report

Received at International Bureau: 30 June 2018 (30.06.2018)

Information valid as of: 06 December 2018 (06.12.2018)

Report generated on: 22 April 2019 (22.04.2019)

(10) Publication number:

WO2019/002478

(43) Publication date:

03 January 2019 (03.01.2019)

(26) Publication language:

German (DE)

(21) Application Number:

PCT/EP2018/067437

(22) Filing Date:

28 June 2018 (28.06.2018)

(25) Filing language:

German (DE)

(31) Priority number(s):

17178655.1 (EP)

(31) Priority date(s):

29 June 2017 (29.06.2017)

(31) Priority status:

Priority document received (in compliance with PCT Rule 17.1)

(51) International Patent Classification:

G01N 21/47 (2006.01); G01N 15/06 (2006.01); G01N 21/27 (2006.01)

(71) Applicant(s):

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Werner-von-Siemens-Straße 1 80333 München (DE) *(for all designated states)*

(72) Inventor(s):

WILLSCH, Michael; Am Lindenberg 2 07745 Jena (DE)

RICHTER, Markus; Geschwister Scholl Straße 59 99085 Erfurt (DE)

(54) Title (EN): DEVICE AND METHOD FOR DETECTING PARTICLES

(54) Title (FR): DISPOSITIF ET PROCÉDÉ DE DÉTECTION DE PARTICULES

(54) Title (DE): VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR DETEKTION VON PARTIKELN

(57) Abstract:

(EN): The invention relates to a device (10) and a method for detecting particles (20), comprising at least one light source (12) and at least one detector (14) for detecting light. At least one medium (16) can be transilluminated by light provided by the light source (12) and has a deposition surface (18) for the particles (20). The detector (14) is designed to detect light penetrating the medium (16) and reflected by the particles (20) deposited on the deposition surface (18).

(FR): L'invention concerne un dispositif (10) ainsi qu'un procédé de détection de particules (20), le dispositif comprenant au moins une source de lumière (12) et au moins un détecteur (14) servant à détecter la lumière, au moins un milieu (16) pouvant être traversé par la lumière émise par la source de lumière (12) et présentant une surface de dépôt (18) pour les particules (20), le détecteur (14) étant conçu pour détecter la lumière qui est réfléchiée par les particules (20) déposées sur la surface de dépôt (18) et qui traverse le milieu (16).

(DE): Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (10) sowie ein Verfahren zur Detektion von Partikeln (20), mit wenigstens einer Lichtquelle (12), und mit wenigstens einem Detektor (14) zum Erfassen von Licht, wobei wenigstens ein Medium (16) von der Lichtquelle (12) bereitgestelltem Licht durchleuchtbar ist, welches eine Ablagerungsoberfläche (18) für die Partikel (20) aufweist, wobei der Detektor (14) dazu ausgebildet ist, von den auf der Ablagerungsoberfläche (18) abgelagerten Partikeln (20) reflektiertes und das Medium (16) durchdringendes Licht zu erfassen.

International search report:

Received at International Bureau: 18 September 2018 (18.09.2018) [EP]

International Report on Patentability (IPRP) Chapter II of the PCT:

Not available

(81) Designated States:

AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA,

PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW

European Patent Office (EPO) : AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR

African Intellectual Property Organization (OAPI) : BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG

African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) : BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW

Eurasian Patent Organization (EAPO) : AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM